

事例5 (株)日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー(株)の株式取得

第1 本件の概要

本件は、分析機器(注1)等の製造販売業を営む株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下「日立ハイテク」という。)が、分析機器の製造販売業を営むエスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社(以下「S I I ナノテク」という。)の全株式を取得すること(以下「本件株式取得」という。)を計画したものである。関係法条は、独占禁止法第10条である。

(注1)分析機器とは、物質の組成、性質、構造、状態等を定性的及び定量的に測定する機械・器具又は装置をいう。

第2 本件審査の経緯及び審査結果の概要

1 本件審査の経緯

当事会社は、本件株式取得に関する計画の届出以前から、当事会社が競合する走査型電子顕微鏡、集束イオンビーム加工観察装置、集束イオン・電子ビーム加工観察装置等の分析機器について、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考える旨の意見書及び資料を自発的に当委員会に提出し、当委員会は、当事会社の求めに応じて、当事会社との間で数次にわたり会合を持った。その後、平成24年7月10日に日立ハイテクから、独占禁止法第10条第2項の規定に基づき、本件株式取得に関する計画の届出があったので、当委員会はこれを受理し、第1次審査を開始した。当委員会は、前記届出書その他の当事会社から提出された資料、需要者及び競争事業者に対するヒアリング等を踏まえつつ、第1次審査を進めた結果、より詳細な審査が必要であると認められたことから、同年8月9日に日立ハイテクに対し報告等の要請を行い、第2次審査を開始するとともに、同日に、第2次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付けることを公表した。

第2次審査において、当委員会は、当事会社から順次提出された報告等のほか、需要者、競争事業者等に対するヒアリング、アンケート調査の結果等を踏まえ、本件株式取得が競争に与える影響について審査を進めた。また、第2次審査期間中、必要に応じて、当事会社と意見交換等を行った。

なお、日立ハイテクに対する報告等の要請については、平成24年11月9日に提出された報告等をもって、全ての報告等が提出された。

2 審査結果の概要

本件においては、当事会社間で競合する製品で競争に与える影響が大きいと考えられる「走査型電子顕微鏡」、「集束イオンビーム加工観察装置」及び「集束イオン・電

子ビーム加工観察装置」の取引分野について、本件株式取得が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。また、これら以外の取引分野については、いずれも、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

前記の「走査型電子顕微鏡」、「集束イオンビーム加工観察装置」及び「集束イオン・電子ビーム加工観察装置」の取引分野に係る審査結果の詳細は、後記第3から第5までのとおりである。

(参考)

平成24年 7月10日 株式取得に関する計画の届出の受理（第1次審査の開始）
8月 9日 報告等の要請（第2次審査の開始）
11月 9日 全ての報告等の受理
（事前通知期限：平成25年2月8日）
12月10日 排除措置命令を行わない旨の通知

第3 走査型電子顕微鏡（SEM）

1 一定の取引分野

(1) 商品範囲

走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope。以下「SEM」という。）とは、電子を加速し集束させて試料に照射し、試料から発生する二次電子や反射電子の信号を画像化して試料を観察する分析機器であり、金属・半導体などの固形試料、植物・細胞などの生物試料等の表面観察に用いられる。

電子顕微鏡の性能は分解能（注2）が重視される場所、分解能を大きく左右するものとして電子銃（注3）がある。SEMに搭載される電子銃は、熱電子銃と電界放出形電子銃に大別され、電界放出形電子銃を搭載したSEM（以下「FE-SEM」という。）は、熱電子銃を搭載したSEM（以下「TE-SEM」という。）より分解能が高い。

分析機器は、それぞれ分析技術に応じて製造された機器であるところ、地方公共団体、大学、半導体メーカー、分析受託事業者等の需要者は、分析目的、分析試料等により最適な機器を選択しており、それぞれ分析能力も異なることから、異なる種類の分析機器間では需要者にとっての代替性はない。また、SEMには、前記のとおりTE-SEMとFE-SEMがあるところ、需要者は分析目的、分析試料等により、それぞれ選択していることから、TE-SEMとFE-SEMの間でも需要者にとっての代替性はない。

したがって、「TE-SEM」及び「FE-SEM」をそれぞれ商品範囲として画定した。

以下では、水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないFE-SEMについて検討を行う。

（注2）分解能とは、物と物を分離して観察できる最短の距離をいう。

（注3）電子銃とは、電子線を発生させる装置をいう。

(2) 地理的範囲

需要者は、おおむね日本国内に本社、販売代理店等を有するメーカーから分析機器を調達しており、日本国内に販売代理店等を有さず、販路が整っていない海外分析機器メーカーとは基本的に取引していない。

したがって、「日本全国」を地理的範囲として画定した。

2 競争の実質的制限についての検討

(1) 市場構造の変化

本件株式取得により、HHIは約4,200、当事会社の合算市場シェア・順位は約55%・第1位、HHIの増分は約500となり、水平型企业結合のセーフハーバー基準に該当しない。

なお、SIIナノテクが販売するFE-SEMは、下表のC社が製造するFE-SEMであり、SIIナノテクは、需要者に対し、C社と同様にC社のFE-SEMを販売しているところ、SIIナノテクは、平成24年12月末をもってC社が製造する製品の販売を取りやめるとしている。

【平成22年度におけるFE-SEMの市場シェア】

順位	会社名	市場シェア
1	日立ハイテク	約50%
2	A社	約35%
3	B社	約5%
4	SIIナノテク	約5%
5	C社	0-5%
合計		100%

(2) 検討の視点

前記(1)のとおり、SIIナノテクは、平成24年12月末をもって、C社が製造するFE-SEMの販売を取りやめることから、FE-SEMについて、当事会社間の競合関係はなくなり、本件株式取得によって独占禁止法上の問題が生じる可能性は低い。

しかしながら、日立ハイテクは現在約50%の市場シェアを有している中で、本件株式取得によりSIIナノテクの営業部門を取得することとなるところ、SIIナノテクが、C社の製品の代わりに日立ハイテクの製品を販売するものとして、本件株式取得が当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動により競争を実質的に制限することとなるかどうかにつき、検討を行った。

(3) 競争事業者の状況

当事会社以外に、市場シェア約35%を有する有力な競争事業者であるA社のほか、今後有力な競争事業者になると考えられるC社など複数の競争事業者が存在する。

(4) 従来の競争状況

F E - S E Mは、研究開発等に用いられる機器であることから、需要者は、分析機器メーカーに対し、高い性能・品質等を求めている。需要者は、F E - S E Mの購入を検討するに当たり、サンプルテスト（注4）等により、性能・品質を競わせた上で調達先を選定しており、また、需要者が公的機関の場合、仕様書における分析機器の性能等に関する条件を満たす分析機器を販売する分析機器メーカーが少なく、入札に参加することができる事業者が限られる場合もある。

例えば、半導体メーカーは、微細化・高集積化した半導体（ウェハ等）を試料として分析するため、需要者の中でも分解能の高い分析機器を必要としているところ、分析機器メーカーは、半導体の技術革新などを考慮し、微細化・高集積化された試料を観察できるよう高分解能のF E - S E Mを開発するなどしている。

また、当事業会社の競争事業者には、世界市場において高い技術力を持ち、日本国内に子会社等を有する海外の事業者も存在し、同事業者との開発競争も行われている。

したがって、F E - S E M市場では積極的な技術革新が行われており、同市場は性能・品質競争が活発な市場であると認められる。

（注4）サンプルテストとは、分析機器メーカーのデモ機が設置されているショールーム等において、需要者が分析したい試料を実際に分析することにより、分析機器の性能・品質等を確認することをいう。

(5) 各事業者の供給余力

各事業者は、一定程度の供給余力を有していると認められる。

(6) 参入圧力

F E - S E Mは、様々な部品から構成されているところ、これらの構成部品を販売する事業者が存在し、かつ、基本特許も権利期間を過ぎているため、一定程度の技術・設備・人員を有する事業者であれば、F E - S E M市場に参入することは可能であると考えられる。

しかしながら、国内におけるF E - S E M市場は、大幅な拡大が見込める市場ではなく、市場規模も限定的であるため、積極的に参入するインセンティブが少ないこと、より高性能の製品を製造するためには高い製品技術が必要となること、過去10年間における国内市場の新規参入業者はほとんどいないことなどを踏まえると、参入圧力が働いているとは認められない。

(7) 隣接市場からの競争圧力

試料の表面観察等を行う分析機器として、FE-SEM以外にTE-SEM、透過型電子顕微鏡（電子を試料に照射し、それを透過した電子が作り出す干渉像を観察するもの。以下「TEM」という。）、ヘリウムイオン顕微鏡等がある。これらの分析機器について、特定の観察において一定程度代替できる部分があるものの、基本的には分析機器の種類によって、観察結果、観察に要する時間、分析機器の価格等が異なるため、需要者は分析目的等によって必要な分析機器を選択している。

したがって、隣接市場からの競争圧力が働いているとは認められない。

(8) 需要者からの価格競争圧力

需要者は、FE-SEMの購入検討に当たり、一般的に価格より性能・品質を重視していることなどから、需要者からの分析機器メーカーに対する価格競争圧力は認められない。

(9) 本件株式取得後の当事会社の営業能力

FE-SEM市場は、市場規模が限定的であり、また、前記(4)のとおり、需要者は製品の性能・品質を重視していることから、当事会社の営業人員等の増加に伴い市場シェアが増加するとは限らず、本件株式取得により日立ハイテクがSIIナノテクの営業部門を取得することに伴う市場シェアの増加は小さく、競争に及ぼす影響も小さいものと考えられる。

3 独占禁止法上の評価

(1) 単独行動による競争の実質的制限

SIIナノテクは、平成24年12月末をもってSEMの販売を取りやめることから、FE-SEMについて、当事会社間での競合関係はなくなる。

加えて、複数の有力な競争事業者が存在すること、各競争事業者は一定程度の供給余力を有していること、FE-SEM市場は性能・品質競争が活発な市場であること及び本件株式取得後、日立ハイテクがSIIナノテクの営業部門を取得するものの、日立ハイテクの市場シェアが現状よりも増加し競争に影響を及ぼす懸念は少ないことから、当事会社が単独で価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

(2) 協調的行動による競争の実質的制限

SIIナノテクは、平成24年12月末をもってSEMの販売を取りやめ、それとともにC社が有力な競争事業者となると考えられるため、FE-SEMの販

売事業者数に実質的な変化はない。

加えて、各事業者は一定程度の供給余力を有していること、F E - S E M市場は性能・品質競争が活発な市場であること及び本件株式取得後、日立ハイテクがS I I ナノテクの営業部門を取得するものの、日立ハイテクの市場シェアが現状よりも増加し競争に影響を及ぼす懸念は少ないことから、当事会社とその競争事業者が協調的行動をとることにより、価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

第4 集束イオンビーム加工観察装置（FIB）

1 一定の取引分野

(1) 商品範囲

集束イオンビーム加工観察装置（Focused Ion Beam。以下「FIB」という。）とは、イオンビームを試料に照射し、試料から放出された二次電子や二次イオンを検出器で受け、試料表面の観察を行う観察機能及びイオンビームを試料に照射することにより試料の加工を行う加工機能を有する分析機器である。FIBは、観察機能及び加工機能を有する分析機器であるが、加工機能が主体の装置であり、半導体デバイスの不良部分など特定の微小領域の微細な精度での切り出しやSEM及びTEMで観察する試料の作成などに用いられ、FIBを購入する需要者はSEMやTEMなどの需要者でもある。観察機能については、一般にSEMよりも分解能が低く、また、観察中にイオンビームにより試料が削れる欠点がある。

なお、後記第5のとおり、FIBには、更に性能や利便性を高めるため、SEMの機能を組み合わせ、試料の微細な加工位置をSEMで確認しながらFIBで加工したり、FIBで加工した試料を移動させず試料ステージの真空状態を保ちながら、そのままSEMで観察できる集束イオン・電子ビーム加工観察装置（以下「FIB-SEM」という。）がある。

前記第3の1(1)のとおり、分析機器は、それぞれ分析技術に応じて製造された機器であるところ、地方公共団体、大学、半導体メーカー、分析受託事業者等の需要者は、分析目的、分析試料等により最適な機器を選択しており、それぞれ分析能力も異なることから、異なる種類の分析機器間では需要者にとっての代替性はない。したがって、「FIB」を商品範囲として画定した。

(2) 地理的範囲

前記第3の1(2)と同様に、「日本全国」を地理的範囲として画定した。

2 競争の実質的制限についての検討

(1) 市場構造の変化

本件株式取得により、HHIは約5,200、当事会社の合算市場シェア・順位は約60%・第1位、HHIの増分は約1,800となり、水平型企业結合のセーフハーバー基準に該当しない。

【平成22年度におけるF I Bの市場シェア】

順位	会社名	市場シェア
1	A社	約40%
2	日立ハイテク	約35%
3	S I I ナノテク	約25%
4	B社	0-5%
合計		100%

(2) 検討の視点

F I B市場は、本件株式取得後、実質的に当事会社及びA社の2社体制となり、当事会社の合算市場シェアは約60%となることから、A社以外の競争事業者、隣接市場にあるF I B－SEM等を考慮すれば、本件株式取得が当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動により競争を実質的に制限することとなるかどうかにつき、検討を行った。

(3) 競争事業者の状況

当事会社以外に、市場シェア約40%を有する有力な競争事業者であるA社が存在する。そのほかの競争事業者として、B社が存在するが、販売実績は少ない。

(4) 従来競争状況

ア 競合他社の状況

前記(3)のとおり、当事会社の競争事業者として、B社が存在するものの、国内市場における販売実績は少ない。しかしながら、B社は、F I B市場及びF I B－SEM市場において、高い技術力を有しており、世界市場においては高いシェアを占めている。

他方、需要者に対するアンケート調査の結果によれば、B社以外のF I Bを使用している需要者の半数は、B社のF I Bについて、当事会社等のF I Bと同等の性能を有しているため、代替することは可能であるとしており、B社からも見積りを取り寄せている需要者も存在した。

イ 性能・品質による競争

前記第3の2(4)と同様に、F I B市場では積極的な技術革新が行われており、同市場は性能・品質競争が活発な市場であると認められる。

(5) 各事業者の供給余力

各事業者は、一定程度の供給余力を有していると認められる。

(6) 参入圧力

F I Bは、様々な部品から構成されているところ、これらの構成部品を販売する事業者が存在し、かつ、基本特許も権利期間が過ぎているため、一定程度の技術・設備・人員を有する事業者であれば、F I B市場に参入することは可能であると考えられる。

しかしながら、国内におけるF I B市場は、大幅な拡大が見込める市場ではなく、市場規模も限定的であるため、積極的に参入するインセンティブが少ないこと、より高性能のF I Bを製造するためには高い製品技術が必要となること、過去10年間における国内市場の新規参入業者はいないことなどを踏まえると、参入圧力が働いているとは認められない。

(7) 隣接市場からの競争圧力

F I Bについては、更に性能や利便性を高めるため、SEMの機能を組み合わせ、試料の微細な加工位置をSEMで確認しながらF I Bで加工したり、F I Bで加工した試料を移動させず試料ステージの真空状態を保ちながら、そのままSEMで観察できるF I B-SEMが開発されているところ、現在、F I BよりもF I B-SEMが主流となっている。そのため、近年では、F I B-SEMがF I Bの販売台数を上回っているところ、平成22年度にはF I B-SEMの販売台数はF I B及びF I B-SEMの合計販売台数の約7割を占めるに至っている。

また、需要者に対するアンケート調査の結果においても、F I Bを保有している需要者の過半が、今後、F I Bの買い替えに当り、F I B-SEMの購入を検討すると回答しており、F I B市場は今後更に縮小していくものと考えられる。

価格については、F I B-SEMはF I BとSEMを組み合わせた製品であり、SEMとF I Bのきょう体等を共通化することができるため、F I BとSEMを個々に購入するより安く、さらに、現在、F I Bよりも価格の安いF I B-SEMも販売されている。

したがって、当事会社以外の者が販売するF I B-SEMは、F I B市場における当事会社の価格引上げ等に対する牽制力となっており、隣接市場からの競争圧力が働いていると認められる。

(8) 需要者からの価格競争圧力

需要者は、F I Bの購入検討に当たり、一般的に価格より性能・品質を重視していることなどから、需要者からの分析機器メーカーに対する価格競争圧力は認められない。

3 独占禁止法上の評価

(1) 単独行動による競争の実質的制限

本件株式取得後、当事会社は約60%の市場シェアを有することとなるものの、有力な競争事業者としてA社が存在するほか、当事会社等と同等の性能を持つFIBの製造販売等を行うB社が存在すること、各競争事業者は一定程度の供給余力を有していること、隣接市場であるFIB-SEMからの競争圧力が働いていること及びFIB市場は性能・品質競争が活発な市場であることから、当事会社が単独で価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

(2) 協調的行動による競争の実質的制限

本件株式取得後、FIB市場における事業者は4社から3社に減少するものの、各事業者は一定程度の供給余力を有していること、隣接市場であるFIB-SEMからの競争圧力が働いていること及びFIB市場は性能・品質競争が活発な市場であることから、当事会社と競争事業者が協調的行動をとることにより、価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

第5 集束イオン・電子ビーム加工観察装置（FIB-SEM）

1 一定の取引分野

(1) 商品範囲

FIB-SEMとは、前記第4のとおり、試料表面の観察を行う観察機能及び電子顕微鏡用の試料等の加工を行う加工機能を有するFIBに、性能や利便性を高めるため、SEMの機能を組み合わせた分析機器である。

FIB-SEMは、SEMを用いて試料の微細な加工位置を確認しながらFIBで加工したり、FIBで加工した試料を移動させず、試料ステージの真空状態を保ちながら、そのままSEMで観察できるようにしたり、SEMでFIB加工中の画像を記録し、画像を重ねることで三次元画像を作成できるなどの特徴を有している。

前記第3の1(1)のとおり、分析機器は、それぞれ分析技術に応じて製造された機器であるところ、地方公共団体、大学、半導体メーカー、分析受託事業者等の需要者は、分析目的、分析試料等により最適な機器を選択しており、それぞれ分析能力も異なることから、異なる種類の分析機器間では需要者にとっての代替性はない。また、FIB-SEMのSEMには、前記第3のSEMと同様に、TE-SEMとFE-SEMがあるところ、需要者は分析目的、分析試料等により、それぞれ選択していることから、この両者の間でも需要者にとっての代替性はない。

したがって、「TE-SEMを搭載したFIB-SEM」及び「FE-SEMを搭載したFIB-SEM」をそれぞれ商品範囲として画定した。

以下では、当事会社間で競合するFE-SEMを搭載したFIB-SEM（以下、FE-SEMを搭載したFIB-SEMを単に「FIB-SEM」という。）について検討を行う。

(2) 地理的範囲

前記第3の1(2)と同様に、「日本全国」を地理的範囲として画定した。

2 競争の実質的制限についての検討

(1) 市場構造の変化

本件株式取得により、HHIは約4,600、当事会社の合算市場シェア・順位は約60%・第1位、HHIの増分は約1,700となり、水平型企业結合のセーフハーバー基準に該当しない。

なお、SIIナノテクが販売するFIB-SEMは、下表のC社との共同開発によるFIB-SEM（以下「共同開発品」という。）及びC社が製造するFIB-SEMであり、共同開発品について、国内市場においてはSIIナノテクのみが販売し、C社が製造するFIB-SEMはC社と同様に、需要者に対し販売しているところ、SIIナノテクは、平成24年12月末をもって、共同開発品及びC社の

製造するFIB-SEMの販売を取りやめるとしている。

【平成22年度におけるFIB-SEMの市場シェア】

順位	会社名	市場シェア
1	SIIナノテク	約35%
2	B社	約30%
3	日立ハイテク	約25%
4	A社	約10%
5	C社	0-5%
合計		100%

(2) 検討の視点

前記(1)のとおり、SIIナノテクは、平成24年12月末をもって、FIB-SEMの販売を取りやめることから、FIB-SEMについて、当事会社間の競合関係はなくなり、本件株式取得によって独占禁止法上の問題が生じる可能性は低い。

しかしながら、SIIナノテクがFIB-SEMの販売を取りやめたとしても、日立ハイテクは、本件株式取得によりSIIナノテクのFIB-SEMに関する営業部門等を取得することとなる。そこで日立ハイテクがSIIナノテクの共同開発品に代えて日立ハイテクの製造する製品を販売するなどして、共同開発品の需要者がそのまま日立ハイテクの製造する製品に移行すること等により、本件株式取得が当事会社の単独行動又は協調的行動による競争を実質的に制限することとなるかどうかにつき、検討を行った。

(3) 競争事業者の状況

当事会社以外に、有力な競争事業者として市場シェア約30%を有するB社及び市場シェア約10%を有するA社が存在する。また、そのほかの競争事業者として、C社が存在する。

(4) 従来競争状況

前記第3の2(4)と同様に、FIB-SEM市場では積極的な技術革新が行われており、同市場は性能・品質競争が活発な市場であると認められる。

(5) 各事業者の供給余力

各事業者は、一定程度の供給余力を有していると認められる。

(6) 参入圧力

国内におけるFIB-SEM市場にあつては、従来FIB-SEMを用いていなかった新たな分野等への需要の拡大が期待されている。

しかしながら、市場規模が限定的であり、積極的に参入するインセンティブが少ないこと、FIB-SEMは、FIBに加えてFE-SEMの製品技術も必要となること、過去10年間における国内市場の新規参入業者はいないことなどを踏まえると、参入圧力が働いているとは認められない。

(7) 需要者からの価格競争圧力

需要者は、FIB-SEMの購入検討に当たり、一般的に価格より性能・品質を重視していることなどから、需要者からの分析機器メーカーに対する価格競争圧力は認められない。

(8) SIIナノテクによる共同開発品の販売取りやめによる需要者の動向

SIIナノテクが平成24年12月末をもって販売を取りやめる共同開発品は、性能や機能面などにおいて、日立ハイテク以外の特定の競争事業者の製品と類似する傾向がみられるところ、需要者に対するアンケート調査の結果においても、多くの同様の回答がなされている。

したがって、SIIナノテクの共同開発品の販売の取りやめにより、共同開発品の顧客が日立ハイテクの顧客となる可能性は低く、今後特定の競合他社の製品に顧客が移行する可能性が高いことから、本件株式取得後に日立ハイテクの市場シェアが著しく増加し、競争に影響を及ぼす懸念は少ないと考えられる。

(9) 本件株式取得後の当事会社の営業能力等

FIB-SEM市場は、市場規模が限定的であり、また、前記第3の2(4)と同様に、需要者は製品の性能・品質を重視していることから、当事会社の営業人員等の増加に伴い市場シェアが増加するとは限らない。また、当事会社は、本件株式取得後、日立ハイテク及びSIIナノテクによる新製品の開発には一定程度の時間を要するとしている。

したがって、本件株式取得により日立ハイテクがSIIナノテクの営業部門等を取得することに伴う市場シェアの増加は小さく、競争に及ぼす影響も小さいものと考えられる。

3 独占禁止法上の評価

(1) 単独行動による競争の実質的制限

SIIナノテクは、平成24年12月末をもってFIB-SEMの販売を取りや

めるため、F I B－S E Mについて、当事会社間での競合はなくなる。

加えて、複数の有力な競争事業者が存在すること、各競争事業者は一定程度の供給余力を有していること、F I B－S E M市場は性能・品質競争が活発な市場であること及びS I I ナノテクとC社による共同開発品の需要者は他の競争事業者の製品へ移行する可能性が高く、本件株式取得後、日立ハイテクの市場シェアが現状よりも増加し競争に影響を及ぼす懸念は少ないことから、当事会社が単独で価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

(2) 協調的行動による競争の実質的制限

S I I ナノテクは、平成24年12月末をもってF I B－S E Mの販売を取りやめ、それとともにC社が実質的に新たな競争事業者となるため、F I B－S E Mの販売事業者数に実質的な変化はない。

加えて、各事業者は一定程度の供給余力を有していること、F I B－S E M市場は性能・品質競争が活発な市場であること及びS I I ナノテクとC社による共同開発品の需要者は他の競争事業者の製品へ移行する可能性が高く、本件株式取得後、日立ハイテクの市場シェアが現状よりも増加し競争に影響を及ぼす懸念は少ないことから、当事会社とその競争事業者が協調的行動をとることにより、価格等のある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく、本件株式取得が競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。